

OLED/QLED 发光器件寿命测试系统

OLED/QLED 发光器件寿命测试系统，具备性能稳定、操作简便、容易升级等优势，在国内外高校及企业获得广泛应用。



32 路系统

64 路系统

项目	关键指标	备注
通道数量	32、64、128	可扩展到 512 路
测量模式 1	恒流、恒压、恒亮度	需根据客户需求选定
测量模式 2	Pulse 电压、Pulse 电流	选配
电流输出	0.03uA~100mA，精度优于 $\pm 1\%$	用户参照核心技术电流源选配
电压输出	1.0~20V，精度 $< \pm 1\%$ 通常 10000cd/m ² 以上	标配
饱和亮度		可根据客户需求定制
器件结构	底发光、顶发光、倒装、正装	需根据用户需求定制
测试盒 / 夹具	测试芯片尺寸 $\leq 5\text{cm} \times 5\text{cm}$	可定制支持 20cm \times 20cm
高温测试	RT+10 度 ~100 度；-50 度 ~100 度；环境测试	选配
特殊条件	特殊气氛测试；手套箱测试；UPS 电源等	选配、定制
软件平台	LabView	稳定、高效